Scanning Tunneling Microscope



Magyarkuti András

I. évf. MSc. fizika 2012. Május 3.

イロン イ部ン イヨン イヨン 三日



(a): két azonos fém, közöttük vákuum, P ∝ Exp {-√(8m/h^2)Φ · d}
(b): két különböző fém, közöttük vákuum, P ∝ Exp {-√(8m/h^2)(Φ₁ + Φ₂)/2 · d}
(c): feszültséget kapcsolunk rá → I ∝ V_b · Exp {-A · d · √Φ}, A = 1.025 Å⁻¹eV^{-1/2}

[Roland Schaefer: Design and Construction of a Scanning Tunneling Microscope, 15213 (1989)]

2012. Május 3.

▶ ★ 臣 ▶ ★ 臣 ▶ 二 臣



Tipikus adatok:

- Minta tű távolság $\approx 4 6$ Å
- ► Alagútáram: I ≈ nA
- ► Tűfeszültség: V_b ≈ V

1 Å változás a távolságban 1 nagyságrend változást jelent az alagútáramban \rightarrow pontos mérést tesz lehetővé!

Üzemmódok:

- Konstans áram:
 - lassú pásztázás (20-30 Hz)
 - gyors szabályozás
- Konstans magasság:
 - ▶ átlagos magasság állandó → lassú szabályozás
 - gyors pásztázás (500Hz)
 - termikus drift kevésbé befolyásolja

臣

STM



Laterális felbontás:

$$\lambda = \sqrt{\frac{R+d}{A\sqrt{\Phi}}}, \qquad \lambda \approx 5 \text{ \AA} \quad \rightarrow \quad R \leq 10 \text{ \AA}$$

- Hegyes tűre van szükség!
- Mechanikai stabilitás:
 - hőtágulás minimalizálása
 - hangszigetelés
 - rezgésmentesítés

< □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < Ξ > = Ξ

Rúgós rezgésmentesítés



- ► Lineáris oszcillátor: $\ddot{x}(t) + 2\gamma \dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = f(t)$
- Jósági tényező: $Q = \frac{\omega}{2\gamma}$
- ▶ Rezonanciafrekvencia: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 \gamma^2}$ minél kisebb, annál előbb vág le az átviteli függvény

• Sajátfrekvencia:
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta L}}$$

[Chen: Introduction to scanning tunneling microscopy]

<ロ> (四) (四) (三) (三) (三)

Csillapítás

Viszkózus csillapítás

Mágneses csillapítás

- $\blacktriangleright \ F = -C_0 \left(\frac{B^2 r^2 \pi t}{\rho} \right) v$
- C₀ geometriától függő állandó:







<ロ> (四) (四) (三) (三) (三) (三)

[Chen: Introduction to scanning tunneling microscopy]

2 fokozatú rugós rezgésmentesítés





Fig. 10.5. Transfer functions for two-stage vibration isolation systems. Parameters for both (a) and (b): $M_{\pi}=24$ Kg, $M_{\pi}=2.9$ Kg, $h_{\pi}=800$ N/m, $h_{\pi}=700$ N/m. In (a), the damping stages are equally arranged, $c_1 = c_1 = c_1$ (..., col. H), e-100 N/m. III, e-20 N/m. IV, c=50 N/m. In (b), the effect of different arrangements of damping is illustrated. I, $c_1 = c_2 = 20$ N/m. II, $c_2=20$ N/s/m, $c_2=0$. III, $c_1 = 0$, $c_2=20$ N/s/m. IV, $c_1 = c_2=0$. (Afree Okano et al., 1975).

• $M_1\ddot{x}_1 + c_1\dot{x}_1 + k_1x_1 + c_2(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k(x_1 - x_2) = c_1\dot{X} + k_1X$

 $M_2 \dot{x_2} + c_2 (\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k(x_2 - x_1) = 0$

 Nagyobb csillapítás, mint az egy fokozatú esetben, UHV, alacsony hőmérsékletű mérések esetén célszerű használni.

[Chen: Introduction to scanning tunneling microscopy]

→ Ξ → < Ξ →</p>

2 fokozatú rugós rezgésmentesítés

• Átlapoló rugók \rightarrow kis méret, alacsony rezonancia frekvencia:



[Sang-il Park, C.F. Quate: Scanning tunneling microscope, Review of Scientific Instruments (1987)]

・ロト ・回ト ・ヨト ・ヨト

Halmozott lemezekből álló rezgésmentesítés

- kompakt méret
- nem szükséges külön csillapítás

¢106

magasabb frekvenciákat szűri ki jól



[Chen: Introduction to scanning tunneling microscopy]

RUBBER

88

æ

물 🖌 🛪 물 🕨

Halmozott lemezekből álló rezgésmentesítés



[A.I.Oliva et al.: Low- and high-frequency vibration isolation for scanning probe microscopy, Meas.Sci.Tech. 9 (1998)]

2012. Május 3.

æ

・ロト ・回ト ・ヨト ・ヨト

Halmozott lemezekből álló rezgésmentesítés



Átvitel különböző paraméterű gumigyűrűk esetén:



Figure 8. The transfer function of the last stage of a seven-stage VIS system obtained with a viton diameter d = 4.7 mm for four viton lengths. The first six masses are equal to 0.206 kg and M = 1.5 kg. Curve (a) corresponds to an entire 'O' ring (L = 390 mm) used between plates. Other curves used the following viton lengths (L): (b) 20 mm, (c) 10 mm and (d) 5 mm. K values were (a) 1516400 m m⁻¹, (b) t2300 m m⁻¹, (c) 15800 m m⁻¹ and (d) 42000 N m⁻¹.

<ロ> <同> <同> <三> <

[A.I.Oliva et al.: Low- and high-frequency vibration isolation for scanning probe microscopy, Meas.Sci.Tech. 9 (1998)]

- < ≣ →

Hangszigetelő doboz vizsgálata:



 A doboz lényegesen lecsökkenti a zajokat, 100 Hz felett gyakorlatilag teljesen szűr.

[Chen, Ching-Tzu: Scanning tunneling spectroscopy studies of high-temperature cuprate superconductors, Ph.D., Caltech (2006)]

イロト イヨト イヨト イヨト

Közelítés

▶ Tű-minta távolság: mm \rightarrow 4 - 6 Å



2012. Május 3.

æ

・ロト ・日本 ・モト ・モト



▶ Piezo tápegység
 ▶ Range ≈ 100 V
 ▶ zaj < mV





Adatgyűjtő/szabályozó elektronika



イロン イヨン イヨン イヨン

2



[Chen, Ching-Tzu: Scanning tunneling spectroscopy studies of high-temperature cuprate superconductors, Ph.D., Caltech (2006)]

2012. Május 3.

2

・ロン ・回 と ・ヨン ・ヨン

Szabályozás



$$v(t) = \frac{\checkmark}{C} = \frac{1}{C} \int_{0}^{C} I(t')dt' = \frac{1}{RC} \int_{0}^{C} [v_{out}(t') - v(t')]dt'$$
$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{1}{RC} [v_{out}(t) - v(t)] = -\frac{1}{RC} v(t) - \frac{abk}{RC} v(t - \tau) + \frac{ab}{RC} h(t)$$

[Sang-il Park, C.F. Quate: Scanning tunneling microscope, Review of Scientific Instruments (1987)]

Nanofizika szeminárium

2012. Május 3.

æ

・ロト ・団ト ・モト・モト

Szabályozás

$$\frac{dv(t)}{dt} = -\frac{1}{RC}v(t) - \frac{abk}{RC}v(t-\tau) + \frac{ab}{RC}h(t)$$

Legyen h(t) lépcsőfüggvény, az állandósult megoldás:

•
$$\frac{dv(t)}{dt} = 0, v(t) = v(t - \tau) \rightarrow v(t) = \frac{ab}{1 + abk}, \Delta s(t) = \frac{-1}{1 + abk}$$

- ▶ abk > 100 esetén nem okoz problémát
- Stabilitás: $abk < \frac{RC}{\tau}e^{-(1+\tau/RC)}$



[Sang-il Park, C.F. Quate: Scanning tunneling microscope, Review of Scientific Instruments (1987)]

2012. Május 3.

<ロ> (四) (四) (三) (三) (三) (三)

Köszönöm a figyelmet!

<ロ> (四) (四) (三) (三) (三) (三)